

# DIN EN ISO 25178-604:2013-12 (D)

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Oberflächenbeschaffenheit: Flächenhaft - Teil 604: Merkmale von berührungslos messenden Geräten (Weißlicht-Interferometrie) (ISO 25178-604:2013); Deutsche Fassung EN ISO 25178-604:2013

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
Einleitung .....	4
1 Anwendungsbereich .....	5
2 Begriffe .....	5
2.1 Begriffe, die sich auf alle flächenhaften Verfahren zur Messung der Oberflächenbeschaffenheit beziehen .....	5
2.2 Begriffe, die sich auf die x- und y-Abtastsysteme beziehen .....	11
2.3 Begriffe, die sich auf optische Systeme beziehen .....	12
2.4 Begriffe, die sich auf die optischen Eigenschaften des Werkstücks beziehen .....	14
2.5 Spezifische Begriffe zur Weißlicht-Interferometrie-Mikroskopie .....	15
3 Beschreibungen der Einflussgrößen .....	18
3.1 Allgemeines .....	18
3.2 Einflussgrößen .....	19
Anhang A (informativ) Überblick und Komponenten eines Weißlicht-Interferometrie-Mikroskops (CSI-Mikroskops) .....	21
Anhang B (informativ) Theorie der Arbeitsweise der Weißlicht-Interferometrie (CSI) .....	26
Anhang C (informativ) Räumliche Auflösung .....	34
Anhang D (informativ) Beispielverfahren zur Abschätzung der Wiederholpräzision der Oberflächentopographie .....	38
Anhang E (informativ) Zusammenhänge mit dem GPS-Matrix-Modell .....	39
Literaturhinweise .....	40